

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-015696

(43)Date of publication of application : 19.01.2001

(51)Int.Cl.

H01L 27/10

C23C 16/40

H01L 21/316

H01L 21/318

H01L 27/108

H01L 21/8242

(21)Application number : 11-183284

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing : 29.06.1999

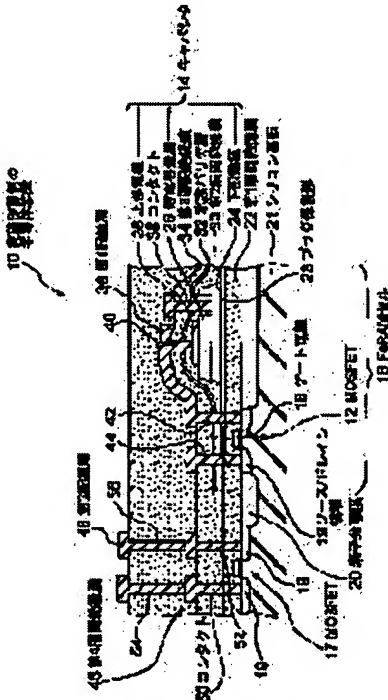
(72)Inventor : NAKURA TAKESHI

(54) HYDROGEN BARRIER LAYER AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a hydrogen barrier layer of less hydrogen in a film, less stress, and low water-permeability.

SOLUTION: A hydrogen barrier layer 32, wherein a capacitor 14 provided with an upper part electrode 28 comprising an electrostatic capacity film 26 of a PZT film and a laminated metal film of IrO₂ film/Ir film is coated so that a hydrogen is prevented from approaching the capacitor 14 for contact, is an SiON film of thickness 600 Å; which is film-formed by a plasma CVD method. Above and below the hydrogen barrier layer 32, interlayer insulating films 34 and 30 comprising O₃-TEOS film are formed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25.05.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

03.07.2003

[Kind of final disposal of application other than
the examiner's decision of rejection or
application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2001-15696
(P2001-15696A)

(43) 公開日 平成13年1月19日 (2001.1.19)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マ-ト* (参考)
H 0 1 L 27/10	4 5 1 4 6 1	H 0 1 L 27/10	4 5 1 4 K 0 3 0 4 6 1 5 F 0 5 8
C 2 3 C 16/40		C 2 3 C 16/40	5 F 0 8 3
H 0 1 L 21/316		H 0 1 L 21/316	X
21/318		21/318	C
審査請求 有 請求項の数 8 O L (全 9 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号 特願平11-183284

(22) 出願日 平成11年6月29日 (1999.6.29)

(71) 出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 発明者 奈倉 健

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社内

(74) 代理人 100096231

弁理士 稲垣 清

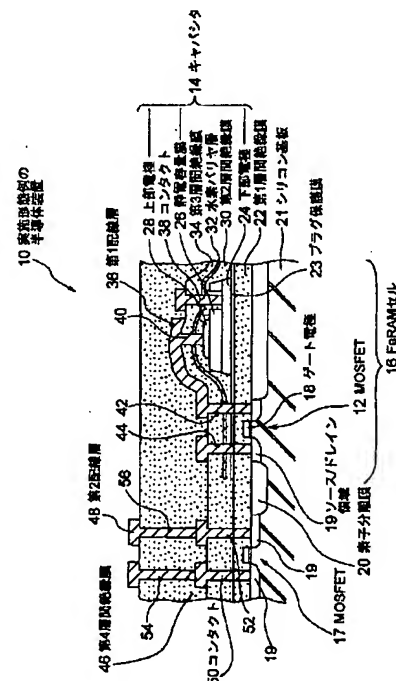
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 水素バリア層及び半導体装置

(57) 【要約】

【課題】 膜中の水素が少なく、ストレスも小さく、かつ水分透過性の低い水素バリア層を提供する。

【解決手段】 P Z T膜からなる静電容量膜26及びI r O₂膜/I r膜の積層金属膜からなる上部電極28を有するキャパシタ14を被覆して、水素がキャパシタ14に近接し、接触するのを防止する水素バリア層32が、プラズマCVD法で成膜した、膜厚600ÅのS i O N膜である。また、水素バリア層32の上下には、O₃-T E O S膜からなる層間絶縁膜が成膜されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 水素との還元反応により性能の低下する、半導体装置の構成要素を被覆して、水素が構成要素又は構成要素に近接し、接触するのを防止する水素バリア層であって、プラズマCVD法で成膜したSiON膜であることを特徴とする水素バリア層。

【請求項2】 水素との還元反応により性能の低下する構成要素を有する半導体装置において、前記を被覆する水素バリア層が、プラズマCVD法で成膜したSiON膜であることを特徴とする半導体装置。

【請求項3】 前記構成要素上に $O_3-TEOS \cdot SiON_2$ 膜を介してプラズマSiON膜が成膜されていることを特徴とする請求項2に記載の半導体装置。

【請求項4】 プラズマSiON膜上に $O_3-TEOS \cdot SiO_2$ 膜又はプラズマ $TEOS \cdot SiO_2$ 膜が成膜されていることを特徴とする請求項3に記載の半導体装置。

【請求項5】 前記構成要素が、金属酸化膜を静電容量膜としたキャパシタであることを特徴とする請求項2から4のうちのいずれか1項に記載の半導体装置。

【請求項6】 金属酸化膜が、PZT膜、SBT膜、BST膜、及び Ta_2O_5 膜のいずれかであることを特徴とする請求項5に記載の半導体装置。

【請求項7】 前記構成要素が、電極を構成する金属膜の少なくとも一部に金属酸化物を有するキャパシタであることを特徴とする請求項2から6のうちのいずれか1項に記載の半導体装置。

【請求項8】 金属酸化物が IrO_2 又は RuO_2 であることを特徴とする請求項7に記載の半導体装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、水素バリア層、及び水素バリア層を備えた半導体装置に関し、更に詳細には、膜中の水素含有量が小さく、水分透過性が低く、しかも温度環境の変化により発生するストレスが小さい水素バリア層、及びそのような水素バリア層を備えた半導体装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】揮発性、又は不揮発性のメモリを備えたロジック混載メモリがある。不揮発性メモリには、従来、EEPROMが用いられてきたが、読み書きスピード、低消費電力、読み書き回数等の点で、EEPROMより優れているFeRAMの必要性が高まっている。

【0003】ところで、ロジックを構成するMOSFETの製造工程では、ゲート電極の界面準位、固定電荷、オン電流値、しきい値電流等のトランジスタ特性を最終的に調整するために、金属配線構造を形成した後、パッシベーション膜を成膜する前に、 $400^{\circ}C \sim 450^{\circ}C$ の温度範囲で、数%から50%の範囲の水素濃度の水素雰

囲気内で、数十分程度の水素アニール処理をウエハに施している。

【0004】一方、FeRAMのキャパシタとして設けられている、PZTやBST等のペロブスカイト型酸化物強誘電体層を用いたキャパシタでは、水素などの還元性雰囲気に遭遇すると、強誘電体層から酸素が脱離してキャパシタ特性が劣化することが知られている。更には、仮に水素アニール処理を施さなくても、例えば、配線層の一部としてタングステンをCVD法で形成する際や、層間絶縁膜としてプラズマCVD法によるシリコン酸化膜を堆積させる際に、水素が発生して、水素アニール処理と同じ効果を強誘電体層に与える。

【0005】そこで、FeRAMセルアレイと、センスアンプ、デコーダ等のFeRAMセルアレイの周辺回路部と、FeRAMセルアレイ及び周辺回路部と協調して所定の演算処理及び入出力処理を行うロジック部とを混載した、従来のロジック混載FeRAMLSIでは、水素アニール処理に代えて窒素アニール処理を行っているものの、トランジスタの回復の程度は、水素アニール処理に比べて劣っている。また、別法として、ロジック混載FeRAMLSIのFeRAMセルアレイを水素バリア層で覆い、周辺部とロジック部とを水素バリア層から露出させた構成を備え、周辺回路部とロジック部に水素アニール処理を施す方法も研究されている。水素バリア層とは、水素収蔵金属、水素不透過金属等で形成された膜を意味し、水素を透過させないようなものを言う。

【0006】水素バリア性を有する膜の成膜材料として、従来、 SiH_4 と NH_3 とからプラズマCVD法により温度 $400^{\circ}C$ 程度で成膜したプラズマSiN膜、熱CVD法によるSiN膜、温度 $100^{\circ}C$ から $200^{\circ}C$ の範囲でスパッタ法により堆積させた TiO_2 膜、及び温度 $100^{\circ}C$ から $200^{\circ}C$ の範囲でスパッタ法により堆積させた、TiN、AlN等の金属窒化物の導電体膜が、提案されている。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】しかし、以下に説明するように、従来の水素バリア膜には、それぞれ、問題があつて、技術的に満足できるものではなかった。

1) プラズマSiN膜には、(1)成膜時に水素が混入し、原子数比で20%から25%の水素が膜中に残留するために、膜の水素含有量が本来的に高く、残留水素のために水素の還元反応を引き起こし易い、(2)水分透過性が比較的高く、プラズマSiN膜上の絶縁膜が水分透過性であれば、半導体装置の構成要素内に水分が透過して半導体素子特性を低下させる、(3)熱処理等の温度環境の変化により、例えば $2 \times 10^9 \text{ dyne/cm}^2$ の圧縮応力から $5 \times 10^9 \text{ dyne/cm}^2$ の引張応力程度の大きなストレスを強誘電体膜に発生させ、強誘電体膜はストレス影響を大きく受けて、強誘電体膜の特性、従ってキャパシタ特性が劣化する。(4) O_3-TEOS 膜

を積層する際の相性が悪い等の問題がある。

【0008】2) 熱CVD法によるSiN膜には、SiN膜の成膜温度が高く、トランジスタの構成要素、キャパシタの強誘電体膜等に好ましくない影響を及ぼすという問題があった。

【0009】3) TiO₂膜は、成膜時に水素が混入せず、従って膜中の残留水素が無く、水分透過性も小さく、熱処理等の温度環境の変化により発生するストレスも小さいものの、(1) 水素により還元されて、膜質が変化し、水素バリア性が無くなるという問題があった。

【0010】4) TiN、AlN等の導電体膜は、成膜時に水素が混入せず、従って膜中の残留水素が無く、水分透過性も小さいものの、(1) 熱処理等の温度環境の変化による発生するストレスが大きいという問題に加えて、(2) 導電体であるから、その適用範囲に制約があって、例えばキャパシタ全体を覆うような態様で適用するのは、短絡等の欠陥が生じ易く、技術的に難しいという基本的な問題があった。

【0011】また、PZT、SBT等の強誘電体で水素バリア膜を形成することも提案されているが、水素が進入してきた時、強誘電体自身を水素に還元させて水素を消費することにより、水素に進入を防止しているので、水素と強誘電体の酸素とが化合して、水分が発生する等の問題があった。

【0012】以上のように、従来、提案されている水素バリア層は、一長一短があって、実用的に満足すべき段階に達しているという水素バリア層は、現在のところ見当たらず、そのために、ロジック混載FeRAMLSIのFeRAMセルアレイを覆ってロジック混載FeRAMLSIに水素アニール処理を施すことができるような水素バリア層の開発が、急がれている。従来の水素バリア層の問題の説明では、静電容量膜として強誘電体膜を使用したキャパシタを例に挙げて、問題を説明したが、静電容量膜として高誘電体膜を使用したキャパシタについて、程度の差こそあれ、同様の問題があった。また、キャパシタに限らず、水素との還元反応により性能の低下する構成要素を有する半導体装置には同様の問題がある。

【0013】そこで、本発明の目的は、膜中の水素が少

なく、ストレスも小さく、かつ水分透過性の低い水素バリア層、及びそのような水素バリア層を備えた半導体装置を提供することである。

【0014】

【課題を解決するための手段】本発明者は、種々の組成の膜を試験した結果、プラズマSiON膜は、水素バリア性が高く、膜中の水素含有量が小さく、水分透過性が低く、しかも温度環境の変化により発生するストレスが小さいことを見出した。

【0015】上記目的を達成するために、上述の知見に基づいて、本発明に係る水素バリア層（以下、第1の発明と言う）は、水素との還元反応により性能の低下する、半導体装置の構成要素を被覆して、水素が構成要素に近接し、接触するのを防止する水素バリア層であって、プラズマCVD法で成膜したSiON膜であることを特徴としている。ここで、半導体装置の構成要素とは、半導体装置の集積回路を構成する回路素子、例えばキャパシタ、トランジスタ、抵抗等を意味し、更にはキャパシタの静電容量膜及び電極等の回路素子の構成要素も含む広い概念である。

【0016】更に、本発明者は、第1の発明のSiON膜の水素バリア性を評価するために、即ちSiON膜を水素バリア層として用いて水素アニール処理を施した時、キャパシタの特性に悪影響を及ぼさないかどうかを試験するために、次の試験を行った。先ず、後述する実施形態例の半導体装置10からMOSFET12とMOSFET17とを除いたもの、即ちキャパシタ14部分と同じ構成で、1辺2μmの正方形の平面形状を有する、2500個のキャパシタ14をアレイ状に配列した構造からなる試料を、実施形態例の半導体装置10と同様にして作製し、同様に水素アニール処理を施した。

【0017】水素バリア層32としてSiON膜を成膜するに当たり、表1に示すように、パラメータとしてN₂Oの流量を変えて、実験例1から4の試料を作製した。尚、実験例3の試料は、実施形態例の半導体装置10のキャパシタ14部分と同じ構成を有し、実施形態例の半導体装置10の作製の際のSiON膜の成膜条件と同じ条件でSiON膜を成膜したものである。

【表1】

実験例	1	2	3	4
N ₂ Oの流量 (sccm)	0	200	400	600
ストレス (×10 ⁹ dyne/cm ²)	7	3	1	0.6
水素含有量 (×10 ²² cm ⁻³)	3.5	2.4	1.9	1.6
耐湿性 (時間)	700	1100	2000 以上	1800

【0018】そして、実験例1から実験例4の試料について、膜中に生じるストレス、膜中の水素含有量、及び耐湿性を測定し、表1に示す結果を得た。耐湿性は、いわゆるPressur Cooler Test によって行い、圧力を作用させた水蒸気中に試料を置き、水分が透過するまでの時間を測定し、その時間が長いものを耐湿性が高いと評価した。表1から判る通り、SiON膜のストレスは、実験例3及び4の試料では、従来のプラズマSiN膜に比べて著しく小さく、また、水素含有量及び耐湿性（即ち水分透過性の逆）は、実験例1から4の試料で、従来のプラズマSiN膜に比べて著しく小さい。実験例3の試料の耐湿性が最も良好であるから、最も緻密なSiON膜であって、水素バリア性が高いと評価できる。

【0019】また、実施形態例の半導体装置10と同じ構成を有し、同じ条件でSiON膜を成膜した実験例3の試料について、ソーヤタワー回路によってキャパシタの印加電圧と電荷密度との関係を測定したところ、図5（a）に示すグラフを得た。一方、水素アニール処理を施していないことを除いて試料と同じ構成のキャパシタについて、その印加電圧と電荷密度との関係を測定したところ、図5（b）に示すグラフを得た。図5（a）と図5（b）との比較から、水素アニール処理を施した試料のキャパシタの電荷密度履歴は、水素アニール処理を施していないキャパシタの電荷密度履歴と殆ど同じであって、試料のキャパシタでは、水素アニール処理の影響が水素バリア層の存在により殆どないことが判る。従って、本発明に係るSiON膜が、水素バリア層として極めて有効であると評価できる。

【0020】尚、図5（c）は後述する第2層間絶縁膜30と第3層間絶縁膜34との間に水素バリア層32としてプラズマSiON膜を介在させていないことを除いて、試料と同じ構成のものに水素アニール処理を施した

後に、キャパシタの印加電圧と電荷密度との関係を測定した結果を示すグラフである。

【0021】本発明に係る半導体装置（以下、第2の発明と言う）は、水素との還元反応により性能の低下する構成要素を有する半導体装置において、前記を被覆する水素バリア層が、プラズマCVD法で成膜したSiON膜であることを特徴としている。

【0022】第2の発明によれば、前記構成要素を被覆する水素バリア層を、例えば強誘電体部分のみにプラズマCVD法で成膜したSiON膜で構成することにより、半導体装置に水素アニール処理を施した際、前記構成要素が水素バリア層の存在により水素に遭遇しないので、前記構成要素の要素特性を維持しつつ、水素アニール処理の必要な領域に水素アニール処理を施すことができる。

【0023】本発明の好適な実施態様では、前記構成要素上にO₃-TEOS・SiO₂膜を介してプラズマSiON膜が成膜されている。プラズマSiON膜及びプラズマSiN膜を、直接、キャパシタ上に成膜することはできない。なぜなら、成膜ガス中の還元雰囲気やプラズマ雰囲気によると思われる原因のため、正常に成膜できないからである。そのため、キャパシタ上に直接成膜できるO₃-TEOS・SiO₂膜を成膜した上で、プラズマSiON膜を成膜することで、成膜雰囲気とキャパシタ構成要素が直接触れることを防いでいる。更には、プラズマSiON膜上にO₃-TEOS・SiO₂膜又はプラズマTEOS・SiO₂膜が成膜されている。O₃-TEOS・SiO₂膜又はプラズマTEOS・SiO₂膜をプラズマSiON膜の上に成膜するのは、配線のエッチング時のオーバーエッチングから、プラズマSiON膜の損傷を防ぐためである。しかし、プラズマSiN膜の場合、プラズマSiN膜上のO₃-T

EOS・SiO₂膜が成長し難いので、エッチング時の制御性が悪い。

【0024】本発明の好適な適用例では、前記構成要素が、金属酸化膜を静電容量膜としたキャパシタである。金属酸化膜の静電容量膜には制約はなく、例えばPZT膜、SBT膜、BST膜及びTa₂O₅膜のいずれかである。PZTとは化学式PbZr_xTi_{1-x}O₃、SBTとは化学式SrBi₂Ta₂O₉、BST膜となり、Ba_xSr_{1-x}TiO₃である。また、PZT膜やSBT膜中の元素の一部をLa、Ca、Sr、Nb等で置換した膜であつてもかまわない。また、前記構成要素が、電極を構成する金属膜の少なくとも一部に金属酸化物を有するキャパシタである。例えば、金属酸化物がIrO₂又はRuO₂である。

【0025】

【発明の実施の形態】以下に、実施形態例を挙げ、添付図面を参照して、本発明の実施の形態を具体的かつ詳細に説明する。

実施形態例1

本実施形態例は、本発明に係る半導体装置の実施形態の一例であつて、図1は本実施形態例の半導体装置の構成を示す断面図である。本実施形態例の半導体装置10は、FeRAMセルと、ロジック部とを備える半導体装置であつて、図1に示すように、MOSFET12とキャパシタ14とを有するFeRAMセル16と、MOSFET17を有するロジック部とから構成されている。

【0026】FeRAMセル16のMOSFET12及びロジック部のMOSFET17は、ゲート絶縁膜上のゲート電極18及びソース／ドレイン領域19等を含めて通常の構造を有するMOSFETであつて、それぞれ、素子分離膜20で分離されてシリコン基板21に形成されている。MOSFET12及び17上には、SiO₂膜からなる第1層間絶縁膜22及び、SiON膜（下層）とSiO₂膜（上層）とからなるプラグ保護膜23が成膜されている。

【0027】キャパシタ14は、プラグ保護膜23上に、順次、形成された、下部電極24、静電容量膜26、及び上部電極28とから構成されている。下部電極24はTi膜（下層）とPt膜（上層）とから構成され、静電容量膜26は強誘電体であるPZT膜で構成され、上部電極28はIrO₂膜（下層）とIr膜（上層）とから構成されている。

【0028】MOSFET12及びキャパシタ14上には、順次、膜厚1000～2000ÅのO₃-TEOS・SiO₂膜からなる第2層間絶縁膜30、膜厚200～1000ÅのプラズマSiON膜からなる水素バリア層32、及び膜厚3000Å以上のO₃-TEOS・SiO₂膜からなる第3層間絶縁膜34が成膜されている。また、第3層間絶縁膜34上には、上から下の順序で、TiN/AlSiCu/TiN/Tiの多層金属膜

からなる第1配線層36が形成され、パターンニングされて各配線を形成している。キャパシタ14の下部電極24と上部電極28、及びMOSFET12のソース／ドレイン領域は、それぞれ、コンタクトホール38、40、42、及び44を介して、第1配線層36の各配線に接続している。

【0029】MOSFET17上には、順次、膜厚2000ÅのO₃-TEOS・SiO₂膜からなる第2層間絶縁膜30、及び膜厚3000ÅのO₃-TEOS・SiO₂膜からなる第3層間絶縁膜34が成膜されていて、ロジック部のMOSFET17は、水素バリア層32によって覆われておらず、水素アニール時に、水素が到達する。

【0030】MOSFET12、キャパシタ14及びMOSFET17の第1配線層36上には、SiO₂膜からなる第4層間絶縁膜46が成膜され、その上に第1配線層36と同じ構成で第2配線層48が成膜され、パターンニングされて、各配線を形成している。MOSFET17のソース／ドレイン領域19は、コンタクトホール50、52を介して第1配線層36に、更にスルーホール54、56を介して第2配線層48の各配線に接続している。

【0031】次に、図2から図4を参照して、本実施形態例の半導体装置10のFeRAMセル部分の作製方法を説明する。図2（a）から（c）、図3（d）から（f）及び図4（g）と（h）は、それぞれ、半導体装置10のFeRAMセル部分を作製する際の工程毎の基板断面図である。尚、ロジック部のMOSFET17の作製方法は従来の方と同一であるから省略する。

【0032】先ず、図2（a）に示すように、従来の方とに従って、シリコン基板21に素子分離膜20を形成し、次いでゲート絶縁膜及びゲート電極18、更にソース／ドレイン領域19を形成する。シリコン基板18上に第1層間絶縁膜22を成膜し、次いで第1層間絶縁膜22を開口して、その中にコンタクトプラグ42、44Yとしてタングステンプラグを埋める。

【0033】次に、第1層間絶縁膜22上に、膜厚2000Åのプラグ保護膜23を成膜する。続いて、スパッタ法により膜厚300ÅのTi膜及び膜厚2000ÅのPt膜を成膜して、下部電極層24を形成する。更に、ゾルゲル法やスパッタ法、CrD法により、3000ÅのPZT膜からなる静電容量膜26を形成する。次いで、膜厚500ÅのIrO₂膜及び膜厚1000ÅのIr膜をスパッタ法により成膜して、上部電極層28を形成して、図2（a）に示す断面構造を得る。

【0034】次に、上部電極層28をエッチングして、上部電極28を形成すると共に静電容量膜26を露出させ、続いて静電容量膜26及び下部電極層24を所定のパターンにエッチングして、キャパシタ14の輪郭を形成すると共にプラグ保護膜23を露出させる。次いで、

キャパシタ14の輪郭を形成した基板を400～600℃の酸素雰囲気中で10～25分間維持し、アニール処理を行う。このアニール処理は、強誘電体膜をパターンニングするために行ったエッチングにより、強誘電体が受けたダメージを回復するためのものである。次に、図2(b)に示すように、静電容量膜26をエッチングしてコンタクト38用の開口39を設ける。また、FeRAMセル16以外の領域のプラグ保護膜23をエッチングして、除去する。

【0035】続いて、図2(c)に示すように、キャパシタ14上及びプラグ保護膜23上に、膜厚1000～2000Åの $O_3-TEOS \cdot SiO_2$ 膜からなる第2層間絶縁膜30を成膜し、次いでプラズマCVD法により膜厚200～1000ÅのSiON膜からなる水素バリア層32、更に膜厚3000Å以上の $O_3-TEOS \cdot SiO_2$ 膜からなる第3層間絶縁膜34を成膜する。また、FeRAMセル16以外の領域の水素バリア層32をエッチングして、除去する。

【0036】第2層間絶縁膜30及び第3層間絶縁膜として設けた $O_3-TEOS \cdot SiO_2$ 膜の成膜条件は、次の通りである。

ガス流量：TEOS/1.0sccm、 O_3 /70g/m³
温度：375℃

【0037】水素バリア層32として設けたSiON膜の成膜条件は、次の通りである。

ガス流量：SiH₄/800sccm、NH₃/600sccm、N₂O/400sccm
温度：300℃
圧力：0.3Torr

【0038】次に、図3(d)に示すように、第3層間絶縁膜34、水素バリア層32、及び第2層間絶縁膜30をエッチングして、下部電極24と接続するコンタクト38及び上部電極28と接続するコンタクト40形成用のコンタクトホール41、43を開く。続いて、コンタクトホール41、43を開いた基板を400～450℃の酸素、又は窒素雰囲気中で10～20分間維持し、アニール処理する。このアニール処理は、下部電極24、静電容量膜26、及び上部電極28で構成されるキャパシタの上に、第2層間絶縁膜30、水素バリア層32、及び第3層間絶縁膜34を形成し、その後コンタクトホール41、43を開く工程において、強誘電体膜が受けたダメージを回復するためのものである。

【0039】次いで、図3(e)に示すように、第3層間絶縁膜34、水素バリア層32、第2層間絶縁膜30、及びプラグ保護膜23をエッチングして、コンタクト42、44のコンタクト下部を露出させるコンタクトホール45、47を開く。

【0040】続いて、図3(f)に示すように、第3層間絶縁膜34上には、上から下の順序で、TiN/AlSiCu/TiN/Tiの膜厚7000Åの多層金属膜

からなる第1配線層36をスパッタ法により形成して、コンタクトホール41、43、45及び47を埋め込んでコンタクト38、40、42、44を形成する共に、第1配線層36を形成する。そして、第1配線層36をパターンニングして各配線を形成する。

【0041】次に、図4(g)に示すように、第1配線層36上にSiO₂膜からなる第4層間絶縁膜46を成膜する。

【0042】次いで、図4(h)に示すように、第1配線層36と同じ構成で第2配線層48を第4層間絶縁膜46上に形成し、パターンニングして各配線を形成する。更に、第2配線層48上に図示しないSiO₂膜を成膜する。続いて、水素ガスと窒素ガスの容量比がH₂:N₂=1:1で、温度400℃の水素ガス/窒素ガス混合雰囲気中で、約20分間水素アニール処理を図4(h)に示す基板に施す。以下、通常の方法に従って、本実施形態例の半導体装置10を完成する。

【0043】

【発明の効果】第1の発明によれば、プラズマCVD法で成膜したSiON膜を水素バリア層とすることにより、水素バリア性が高く、膜中の水素含有量が小さく、水分透過性が低く、しかも温度環境の変化により発生するストレスが小さい水素バリア層を実現している。第2の発明によれば、水素との還元反応により性能の低下する構成要素を有する半導体装置において、前記構成要素を被覆する水素バリア層をプラズマCVD法で成膜したSiON膜で構成することにより、半導体装置に水素アニール処理を施した際、前記構成要素が水素バリア層の存在により水素に遭遇しないので、前記構成要素の要素特性を維持しつつ、水素アニール処理の必要な領域に水素アニール処理を施すことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施形態例の半導体装置の構成を示す断面図である。

【図2】図2(a)から(c)は、それぞれ、実施形態例の半導体装置を作製する際の工程毎の基板断面図である。

【図3】図3(d)から(f)は、それぞれ、図2(c)に続いて、実施形態例の半導体装置を作製する際の工程毎の基板断面図である。

【図4】図4(g)と(h)は、それぞれ、図3(f)に続いて、実施形態例の半導体装置を作製する際の工程毎の基板断面図である。

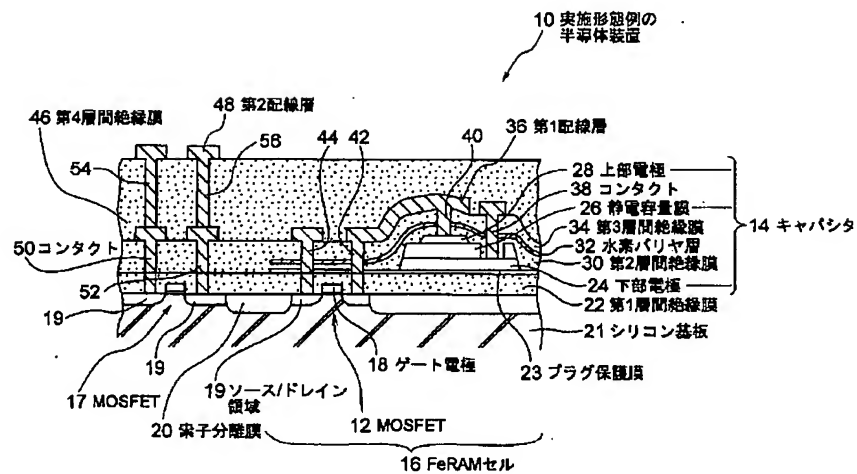
【図5】図5(a)から(c)は、それぞれ、キャパシタの印加電圧と電荷密度との関係を示すグラフである。

【符号の説明】

- 10 実施形態例の半導体装置
- 12 MOSFET
- 14 キャパシタ
- 16 FeRAMセル

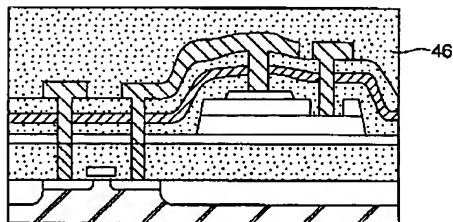
- | | |
|---------------|----------------------|
| 17 MOSFET | 28 上部電極 |
| 18 ゲート電極 | 30 第2層間絶縁膜 |
| 19 ソース/ドレイン領域 | 32 水素バリア層 |
| 20 素子分離膜 | 34 第3層間絶縁膜 |
| 21 シリコン基板 | 36 第1配線層 |
| 22 第1層間絶縁膜 | 38、40、42、44 コンタクトホール |
| 23 プラグ保護膜 | 46 第4層間絶縁膜 |
| 24 下部電極 | 48 第2配線層 |
| 26 静電容量膜 | 50、52、54、56 コンタクトホール |

【図1】

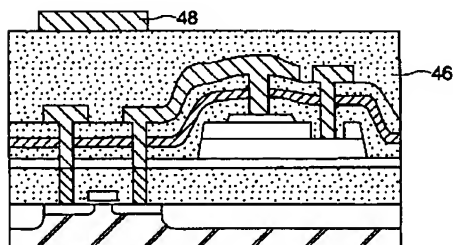


【図4】

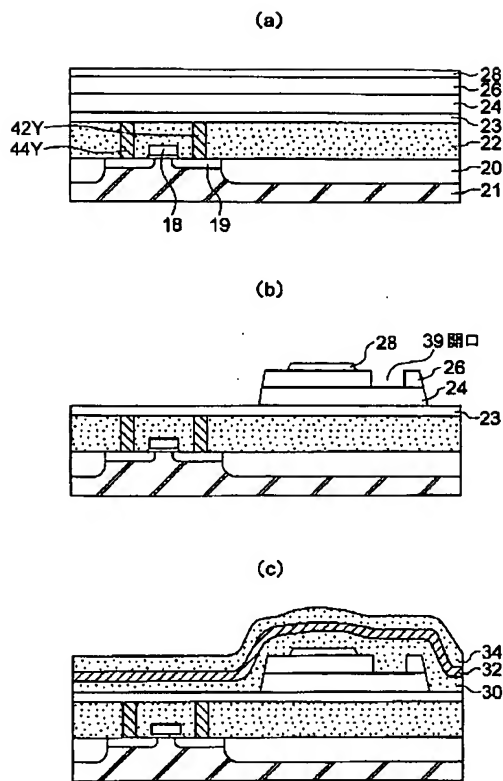
(g)



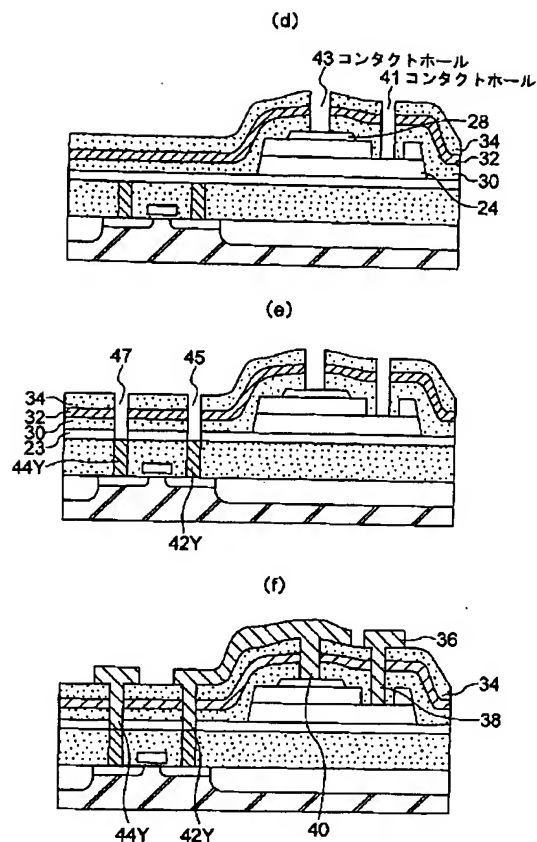
(h)



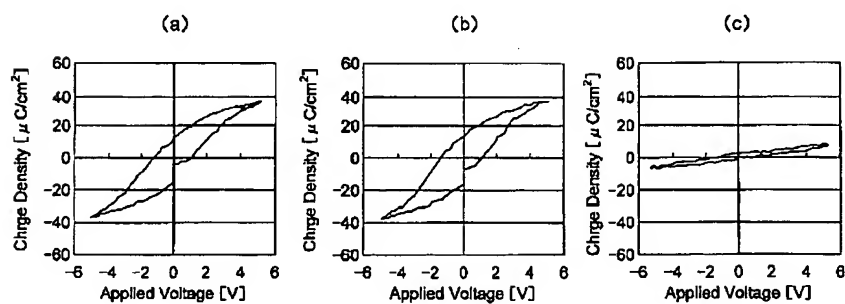
【図 2】



【図 3】



【図 5】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

H 0 1 L 27/108
21/8242

識別記号

F I

H 0 1 L 27/10

テーマコード (参考)

6 5 1

Fターム(参考) 4K030 BA29 BA35 BA42 BA44 BB12
CA04 FA01
5F058 BA11 BA20 BB06 BC01 BC11
BF07 BF23 BF25 BF29 BF30
BF54 BH01 BJ10
5F083 AD21 AD60 FR02 GA30 JA06
JA14 JA15 JA17 JA36 JA37
JA38 JA39 JA40 JA43 JA56
MA06 MA18 MA19 MA20 PR21
PR33 ZA12